



JESUÍTAS BRASIL



UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 453, de 21/11/1983, D.O.U. de 22/11/1983, Portaria Ministerial nº 1083, de 20/11/2009, D.O.U. de 23/11/2009 e recredenciada pela Portaria Ministerial nº 1426 de 07/10/2011, D.O.U. de 10/10/2011
São Leopoldo - Rio Grande do Sul - Brasil

CERTIFICADO

Concedemos a RAFAEL BEZ NASCIMENTO este certificado de Frequência no Curso

Introdução a Tecnologias de Memória NAND Flash

Nível: Extensão Universitária

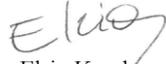
Âmbito: Local

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos
Instituto Tecnológico de Semicondutores - Itt Chip

Realização: 29 e 31 de agosto de 2018

Duração: 8 horas

São Leopoldo, 22 de setembro de 2018.


Elcio Kondo
Coordenador do Laboratório Teste Elétrico

PROGRAMA

- Introdução à Memórias.
- História e Aplicações de NAND Flash.
- Célula Básica: Floating Gate, Operações, SLC x MLC.
- Arquitetura da Memória NAND.
- Interface ONFI.
- 3D NAND.
- Controlador de Memória NAND.
- Dispositivos e Interfaces.
- Teste de Memória NAND.

Coordenador: *Elcio Kondo*.

Ministrantes: *Elcio Kondo e Marcelo de Souza Moraes*.

Frequência mínima exigida: 75%.

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE DE APOIO DE SERVIÇOS ACADÊMICOS

Registro n.º 14, folha 1007 do livro EX033.

São Leopoldo, 22 de setembro de 2018.


Gerência de Registros Acadêmicos

